



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20120326000
2012 年 4 月 5 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HVAL/HPA/PWR OI プロセス 一部製品 前処理サイト変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

既にご存知のように、6 インチウェーハ前処理サイト、弊社日出工場及びヒューストン工場の閉鎖について、本年 1 月に報告させていただきました。本移行対象製品に関する変更通知は、今後数週間に渡り、プロセステクノロジー毎に段階的に行われます。本変更通知は、代替前処理サイトへの OI プロセス対象製品移行に関する連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日**以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけただけのものとして判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、現行前処理サイト閉鎖までに新前処理サイト製品のご評価を完了いただけますように、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90 日**以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	<input checked="" type="checkbox"/> Wafer Fab	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling	<input type="checkbox"/>	-
変更内容	HVAL/HPA/PWR OIプロセス 一部製品 前処理サイト変更 現行 : TI-Hi ji (日本) 変更後 : TI-SFAB (Sherman, 米国)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	7月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し	<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり		
備考	-			

変更内容

内容: 弊社 HVAL(ハイボリュームアナログロジック)/HPA(ハイパフォーマンスアナログ)/PWR(パワーマネジメント) OIプロセス 一部製品の 前処理サイトについて、現行 TI-Hi ji (日本) サイトにおいて製造していますが、TI-Hi ji サイト閉鎖による供給能力確保の為に、これに替えて、TI-SFAB (Sherman, 米国) サイトに変更します。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
OIプロセス前処理サイト	TI-Hi ji (日本)	TI-SFAB (Sherman, 米国)
ウェーハ径	150 mm	150 mm

理由: TI-Hi ji サイト閉鎖による供給能力確保の為

詳細:

TI-SFAB サイトにおける成熟技術である OI プロセス製品の製造は 2001 年より認定されています。下記信頼性試験結果を参照下さい。

対象製品リスト

対象製品名				
CDC303NS	SN75ALS172DWG4	TL1464IPTG4	TLV431AIDBVE4	TLV431CDBZRG4
CDC303NSG4	SN75ALS172DWR	TL1464IPTR	TLV431AIDBVTG4	TLV431CLP
CDC303NSR	SN75ALS172DWRE4	TL1464IPTRG4	TLV431AIDBZR	TLV431CLPE3
CDC303NSRG4	SN75ALS172DWRG4	TLV431ACDBV7	TLV431AIDBZRG4	TLV431CLPM
SN65ALS541NS	SN75ALS172N	TLV431ACDBVR	TLV431AIDBZR-P	TLV431CLPME3
SN65ALS541NSR	SN75ALS172NE4	TLV431ACDBVRE4	TLV431AIDE4	TLV431CLPR
SN65ALS541NSRG4	SN75ALS174ADW	TLV431ACDBVRG4	TLV431AIDG4	TLV431CLPRE3
SN65ALS543NS	SN75ALS174ADWE4	TLV431ACDBVT	TLV431AIDR	TLV431IDBVR
SN65ALS543NSR	SN75ALS174ADWG4	TLV431ACDBVTE4	TLV431AIDRE4	TLV431IDBVRE4
SN65ALS544NS	SN75ALS174ADWR	TLV431ACDBVTG4	TLV431AIDRG4	TLV431IDBVRG4
SN65ALS544NSG4	SN75ALS174ADWRE4	TLV431ACDBZR	TLV431AILP	TLV431IDBVT
SN65ALS544NSR	SN75ALS174ADWRG4	TLV431ACDBZRG4	TLV431AILPE3	TLV431IDBVE4
SN65ALS544NSRG4	SN75ALS174AN	TLV431ACDBZRL1	TLV431AILPM	TLV431IDBVTG4
SN75ALS172ADW	SN75ALS174ANE4	TLV431ACLIP	TLV431AILPME3	TLV431IDBZR
SN75ALS172ADWE4	SN75ALS174DW	TLV431ACLPE3	TLV431AILPR	TLV431IDBZRG4
SN75ALS172ADWG4	SN75ALS174DWE4	TLV431ACLPR	TLV431AILPRE3	TLV431ILP

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

SN75ALS172ADWR	SN75ALS174DWG4	TLV431ACLPRE3	TLV431CDBVR	TLV431ILPE3
SN75ALS172ADWRE4	SN75ALS174DWR	TLV431AID	TLV431CDBVRE4	TLV431ILPR
SN75ALS172ADWRG4	SN75ALS174DWRE4	TLV431AIDBV6	TLV431CDBVRG4	TLV431ILPRE3
SN75ALS172AN	SN75ALS174DWRG4	TLV431AIDBVR	TLV431CDBVT	
SN75ALS172ANE4	SN75ALS174N	TLV431AIDBVRE4	TLV431CDBVTE4	
SN75ALS172DW	SN75ALS174NE4	TLV431AIDBVRG4	TLV431CDBVTG4	
SN75ALS172DWE4	TL1464IPT	TLV431AIDBVT	TLV431CDBZR	

製品表示

この変更に伴い、出荷ラベルに記載の前処理サイト・生産国記号(ラベルの"20L/21L"の箇所)及びラベル上の表示位置は下記の様になります。

	現行	変更後
Fab Site: 前処理サイト	TI-Hiji	TI-SFAB
CSO (20L): 前処理サイト記号	HIJ	SHE
CCO (21L): 生産国記号	JPN	USA



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2001年
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN75ALS170ADW	-	-	
Wafer Fab Site:	SFAB	Wafer Fab Process:	OI	
Wafer Diameter(mm):	150	Metallization:	TiW/AiCu2	
Passivation:	10KA CN	MSL:	JEDEC L-1/220C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	150C, 500 hrs	116/0	116/0	116/0
**HAST	130C/85%RH, 100 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
ESD HBM	1000V	3/0	3/0	3/0
ESD CDM	500V	3/0	3/0	3/0
Ball Shear	Ball Bonds	52/0	76/0	32/0
Bond Pull	Wires	80/0	76/0	80/0
Die Shear	-	5/0	5/0	5/0
Manufacturability (Assembly)	Per mfg site spec	Approved	Approved	Approved
Electrical Characterization	-	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning: JEDEC L-1/220C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2001年
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74ALS646ADW	-	-	
Wafer Fab Site:	SFAB	Wafer Fab Process:	OI	
Wafer Diameter(mm):	150	Metallization:	TiW/AiCu2	
Passivation:	10KA CN	MSL:	JEDEC L-1/220C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	150C, 500 hrs	116/0	116/0	116/0
**HAST	130C/85%RH, 100 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
ESD HBM	1000V	3/0	3/0	3/0
ESD CDM	500V	3/0	3/0	3/0
Ball Shear	Ball Bonds	52/0	76/0	32/0
Bond Pull	Wires	80/0	76/0	80/0
Die Shear	-	5/0	5/0	5/0
Manufacturability (Assembly)	Per mfg site spec	Approved	Approved	Approved
Electrical Characterization	-	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning: JEDEC L-1/220C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2001年
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74F245DW	-	-	
Wafer Fab Site:	SFAB	Wafer Fab Process:	OI	
Wafer Diameter(mm):	150	Metallization:	TiW/AiSiCu.5%	
Passivation:	10KA CN	MSL:	JEDEC L-1/220C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**Life Test	150C, 500 hrs	116/0	116/0	116/0
**HAST	130C/85%RH, 100 Hrs	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
ESD HBM	1000V	3/0	3/0	3/0
ESD CDM	500V	3/0	3/0	3/0
Ball Shear	Ball Bonds	52/0	76/0	32/0
Bond Pull	Wires	80/0	76/0	80/0
Die Shear	-	5/0	5/0	5/0
Manufacturability (Assembly)	Per mfg site spec	Approved	Approved	Approved
Electrical Characterization	-	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning: JEDEC L-1/220C				